



## **PRENDRE la MESURE de notre AVENIR ... R&D et BONNES PRATIQUES MESURE dans l'INDUSTRIE**

Le **Congrès International de Métrologie** revient du **19 au 21 septembre 2017** à **Paris**, en conjonction avec le Salon ENOVA.

Cette manifestation, à vocation industrielle, permet :

- d'améliorer ses processus de mesure, d'analyse et d'essais, et de maîtriser ses risques,
- de suivre les évolutions des techniques, les avancées R&D et découvrir des applications industrielles pratiques,
- de trouver sur l'exposition des technologies et des solutions de mesure.

Les **conférences** concernent :

- les processus : incertitudes, étalonnage, vérification, optimisation des coûts ...
- les techniques pour toutes grandeurs physiques, chimiques et biologiques,
- les perspectives : mesures dynamiques, fabrication additive, data métrologie, réseaux intelligents, nanotechnologie, biotechnologie, santé, environnement.

**Appel à conférences jusqu'au 15 janvier 2017.**

**Infos et réponse à l'Appel à conférences :**

[info@cfmetrologie.com](mailto:info@cfmetrologie.com)

[www.cim2017.com](http://www.cim2017.com)